

7/4

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)



УТВЕРЖАЮ

Документ подписан электронной подписью

Сертификат: 1с6сfa0a-52a6-4f49-aef0-5584d3fd4820

Владелец: Троян Павел Ефимович

Действителен: с 19.01.2016 по 16.09.2019

«15»

08

2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НАНОЭЛЕКТРОНИКА

Уровень основной образовательной программы бакалавриат

Направления подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

Профиль «Нанотехнологии в электронике и микросистемной технике»

Форма обучения очная

Факультет электронной техники (ФЭТ)

Кафедра физической электроники (ФЭ)

Курс 3 Семестр 5

Учебный план набора 2013 года и последующих лет.

Распределение рабочего времени:

| № | Виды учебной работы | Семестр 1 | Семестр 2 | Семестр 3 | Семестр 4 | Семестр 5 | Семестр 6 | Семестр 7 | Семестр 8 | Всего | Единицы |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|
| 1. | Лекции | | | | | 18 | | | | 18 | часов |
| 2. | Лабораторные работы | | | | | - | | | | - | часов |
| 3. | Практические занятия | | | | | 18 | | | | 18 | часов |
| 4. | Курсовой проект/работа (КРС) (аудиторная) | | | | | - | | | | - | часов |
| 5. | Всего аудиторных занятий (Сумма 1-4) | | | | | 36 | | | | 36 | часов |
| 6. | Из них в интерактивной форме | | | | | 0 | | | | 0 | часов |
| 7. | Самостоятельная работа студентов (СРС) | | | | | 36 | | | | 36 | часов |
| 8. | Всего (без экзамена) (Сумма 5,7) | | | | | 72 | | | | 72 | часов |
| 9. | Самост. работа на подготовку, сдачу экзамена | | | | | 36 | | | | 36 | часов |
| 10. | Общая трудоемкость (Сумма 8,9) | | | | | 108 | | | | 108 | часов |
| | (в зачетных единицах) | | | | | 3 | | | | 3 | ЗЕТ |

Экзамен 5 семестр

Томск 2016


Лист согласований

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника (квалификация (бакалавр), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.03.2015 г. № 177.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры физической электроники от «30» _____ 06 _____ 2016 г., протокол № 71 _____.

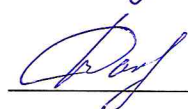
Разработчик:

Доцент кафедры ФЭ

 / Ю.В. Сахаров


Заведующий кафедрой

Профессор кафедры ФЭ

 / П.Е. Троян

Рабочая программа согласована с факультетом, профилирующей и выпускающей кафедрами направления подготовки.


Декан _____ ФЭТ _____

 / А.И. Воронин

Зав. профилирующей
кафедрой _____ ФЭ _____


 / П.Е. Троян

Зав. выпускающей
кафедрой _____ ФЭ _____


 / П.Е. Троян

Эксперты:

Председатель методической
комиссии факультета ФЭТ

 / _____ И.А. Чистоедова

Председатель методической
комиссии кафедры ФЭ

 / _____ И.А. Чистоедова

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Нанoeлектроника» является формирование научной основы, необходимой для создания элементов, приборов и устройств микро- и нанoeлектроники

Задачей изучения дисциплины «Нанoeлектроника» является изучение законов физики наноразмерных полупроводниковых структур для последующего использования их при разработке и эксплуатации приборов и устройств микроволновой, цифровой и оптической электроники, а также при проектировании электронных схем на их основе.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

В соответствии с основной образовательной программой дисциплина «Нанoeлектроника» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 (**Б1.В.ДВ.12**).

Основой для изучения дисциплины «Нанoeлектроника» являются курсы: физика, квантовая механика, физика конденсированного состояния, твердотельная электроника.

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: квантовая и оптическая электроника, технология кремниевой нанoeлектроники.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Изучение дисциплины направлено на формирование у бакалавров следующих компетенций:

- **ОПК-5** способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных;
- **ОПК-7** способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности;
- **ПК-1** способностью проводить физико-математическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных технологий.

3.2. В результате изучения дисциплины бакалавр должен:

знать:

- основные приемы представления и обработки экспериментальных и расчетных данных приборов и устройств нанoeлектроники;
- современное состояние и тенденции развития нанoeлектроники;
- физико-математический аппарат для расчета приборов и устройств нанoeлектроники.

уметь:

- проводить обработку экспериментальных данных приборов и устройств нанoeлектроники;
- проводить анализ научно-технической литературы в области нанoeлектроники;
- проводить физико-математический расчет приборов и устройств нанoeлектроники.

владеть:

- методикой представления и обработки экспериментальных данных приборов и устройств нанoeлектроники;
- физическими принципами работы приборов и устройств нанoeлектроники;
- методикой расчета приборов и устройств нанoeлектроники.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |
|---|-------------|------------|
| | | 5 |
| Аудиторные занятия (всего) | 36 | 36 |
| В том числе: | | |
| Лекции | 18 | 18 |
| Лабораторные работы | - | - |
| Практические занятия | 18 | 18 |
| Самостоятельная работа (всего) | 36 | 36 |
| В том числе: | | |
| Проработка лекционного материала | 10 | 10 |
| Выполнение практических заданий | 8 | 8 |
| Выполнение и защита индивидуального задания | 8 | 8 |
| Подготовка к контрольным работам КР-1, КР-2 | 10 | 10 |
| Вид промежуточной аттестации (экзамен) | 36 | 36 |
| Общая трудоемкость, час | 108 | 108 |
| Зачетные Единицы Трудоемкости | 3 | 3 |

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий

| № п/п | Наименование раздела дисциплины | Лекции | Практические занятия | Самост. работа студента | Всего час | Формируемые компетенции (ПК, ОПК) |
|-------|--|--------|----------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1. | Введение | 2 | - | 2 | 4 | ОПК-7 |
| 2. | Физические основы нанoeлектроники. | 6 | 6 | 8 | 20 | ОПК-7, ПК-1 |
| 3. | Способы формирования квантово-размерных наноструктур | 2 | - | 8 | 10 | ОПК-7 |
| 4. | Квантовые эффекты | 4 | 4 | 8 | 16 | ОПК-5, ОПК-7, ПК-1 |
| 5. | Устройства нанoeлектроники | 4 | 8 | 10 | 22 | ОПК-5, ОПК-7, ПК-1 |

5.2. Содержание разделов дисциплины (по лекциям)

| № п/п | Наименование разделов | Содержание разделов | Трудоемкость (час.) | Формируемые компетенции (ПК, ОПК) |
|-------|--|--|---------------------|-----------------------------------|
| 1. | Введение | Предмет дисциплины и ее задачи. Основные этапы исторического развития нанoeлектроники и нанотехнологии. Связь с другими дисциплинами. Задачи курса. | 2 | ОПК-7 |
| 2. | Физические основы нанoeлектроники. | Волны Де Бройля. Квантовое ограничение. Полупроводниковые гетероструктуры. Сверхрешетки. Полупроводниковые сверхрешетки. Энергетические диаграммы сверхрешеток. Энергетический спектр электронов в сверхрешетках. Свойства электронного газа в сверхрешетках. Влияние квантоворазмерных эффектов на свойства вещества. | 6 | ОПК-7, ПК-1 |
| 3. | Способы формирования квантово-размерных наноструктур | Формирование квантовых точек. Формирование квантовых проволок (нитей). Формирование квантовых ям. | 2 | ОПК-7 |
| 4. | Квантовые | 2D-электронный газ в магнитном поле. Целочисленный и | 4 | ОПК-5, ОПК-7, |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|---|--------------------|
| | эффекты | дробный квантовый эффект Холла. Эффект Ааронова-Бома. Эффект Штарка. Квантово-размерный эффект Штарка в гетеронаноструктурах с квантовыми ямами. Туннельный эффект. Эффект Джозефсона. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с одним туннельным переходом. Кулоновская блокада с двумя туннельными переходами. Сотуннелирование. | | ПК-1 |
| 5. | Устройства нанoeлектроники | Приборы на резонансном туннелировании. Диоды на резонансном туннелировании. Транзисторы на резонансном туннелировании. Логические элементы на резонансно-туннельных приборах. Приборы на одноэлектронном туннелировании. Одноэлектронный транзистор. Одноэлектронный насос. Одноэлектронная память. Устройства на основе сверхрешеток. Инфракрасные фотоприемники. Сверхрешетки в лазерных структурах. Квантовые каскадные лазеры. Лавинные фотодиоды. Оптические модуляторы. Транзисторы с высокой подвижностью НЕМТ. | 4 | ОПК-5, ОПК-7, ПК-1 |

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами

| № п/п | Наименование обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин | № № разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение обеспечивающих (предыдущих) и обеспечиваемых (последующих) дисциплин | | | | |
|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Предшествующие дисциплины | | | | | | |
| 1. | физика | + | + | + | + | + |
| 2. | квантовая механика | + | + | + | + | + |
| 3. | физика конденсированного состояния | | + | + | + | + |
| 4. | твердотельная электроника | + | | | + | + |
| Последующие дисциплины | | | | | | |
| 1. | квантовая и оптическая электроника | | + | + | + | + |
| 2. | технология кремниевой нанoeлектроники | | | + | + | + |

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий

| Перечень компетенций | Виды занятий | | | Формы контроля |
|----------------------|--------------|----|-----|---|
| | Л | ПЗ | СРС | |
| ОПК-5 | | + | + | Защита индивидуального задания. Работа на практических занятиях. Решение задач у доски. Оценка за контрольную работу. |
| ОПК-7 | + | + | + | Опрос на лекциях. Защита индивидуального задания. Оценка за контрольную работу. |
| ПК-1 | | + | + | Защита индивидуального задания. Работа на практических занятиях. Решение задач у доски. Оценка за контрольную работу. |

6. МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ

6.1. Технологии интерактивного обучения при разных формах занятий в часах не предусмотрены

7. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

не предусмотрен

8. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ)

| № п/п | № раздела дисциплины | Тематика практических занятий | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ПК, ОПК |
|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------|
| 1. | 2 | Квантовое ограничение. Энергетические диаграммы сверхрешеток | 2 | ПК-1 |
| 2. | 2 | Полупроводниковые гетероструктуры. Сверхрешетки. Полупроводниковые сверхрешетки. | 4 | ПК-1 |
| 3. | 4 | 2D-электронный газ в магнитном поле. Целочисленный и дробный квантовый эффект Холла. Туннельный эффект. Эффект Джозефсона | 2 | ПК-1 |
| 4. | 4 | Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с одним туннельным переходом. Кулоновская блокада с двумя туннельными переходами | 2 | ПК-1 |
| 5. | 5 | Инфракрасные фотоприемники. Квантовые каскадные лазеры. | 2 | ПК-1 |
| 6. | 5 | Одноэлектронный транзистор | 2 | ПК-1 |
| 7. | 2 | КР-1. Основы нанoeлектроники | 2 | ПК-1 |
| 8. | 4, 5 | КР-2. Квантовые эффекты. Приборы нанoeлектроники. | 2 | ПК-1 |

9. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

| № п/п | № раздела дисциплины | Тематика самостоятельной работы (детализация) | Трудо-емкость (час.) | Компетенции ПК, ОПК | Контроль выполнения работы |
|-------|----------------------|---|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1. | 1-5 | Проработка лекционного материала | 10 | ОПК-7 | Опрос на лекциях |
| 2. | 2-5 | Выполнение практических занятий | 10 | ПК-1 | Отчеты по практическим работам |
| 3. | 2, 4, 5 | Проработка лекционного материала при подготовке к контрольным работам | 16 | ОПК-7, ПК-1 | Результаты контрольных работ |
| 4. | 4,-5 | Выполнение практико-ориентированных задач и проектов | 10 | ОПК-5 | Отчеты по задачам и проектам |
| 5. | 2, 4, 5 | Выполнение и защита индивидуального задания | 10 | ОПК-7, ПК-1 | Защита индивидуального задания |

10. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)

не предусмотрено

11. РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Таблица 11.1. Балльные оценки для элементов контроля

| Элементы учебной деятельности | Максимальный балл на 1-ую КТ с начала семестра | Максимальный балл за период между 1КТ и 2КТ | Максимальный балл за период между 2КТ и на конец семестра | Всего за семестр |
|---|--|---|---|------------------|
| Выполнение и защита индивидуального задания | | 20 | | 20 |
| Контрольные работы | 20 | 20 | | 40 |
| Отчеты по практическим занятиям | 5 | 10 | 5 | 20 |
| Компонент своевременности | | | 10 | 10 |
| Посещение занятий | | | 10 | 10 |
| Итого максимум за период: | 25 | 40 | 35 | 100 |
| Нарастающим итогом | 25 | 65 | 100 | 100 |

Таблица 11.2. Пересчет баллов в оценки за контрольные точки

| Баллы на дату контрольной точки | Оценка |
|---|--------|
| ≥ 90 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 5 |
| От 70% до 89% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 4 |
| От 60% до 69% от максимальной суммы баллов на дату КТ | 3 |
| < 60 % от максимальной суммы баллов на дату КТ | 2 |

Таблица 11.3. Пересчет суммы баллов в традиционную и международную оценку

| Оценка (ГОС) | Итоговая сумма баллов, учитывает успешно сданный экзамен | Оценка (ECTS) |
|--|--|-------------------------|
| 5 (отлично) (зачтено) | 90 – 100 | A (отлично) |
| 4 (хорошо) (зачтено) | 85 – 89 | B (очень хорошо) |
| | 75 – 84 | C (хорошо) |
| | 70 – 74 | D (удовлетворительно) |
| 3 (удовлетворительно) (зачтено) | 65 – 69 | E (посредственно) |
| | 60 – 64 | F (неудовлетворительно) |
| 2 (неудовлетворительно), (не зачтено) | Ниже 60 баллов | F (неудовлетворительно) |

Тематика индивидуальных заданий:

Тема индивидуального задания:

Расчет устройств нанoeлектроники

Варианты приведены в учебно-методическом пособии (п.5).

Тематика контрольных работ:

Тема контрольной работы № 1: *Физические основы нанoeлектроники* (Раздел 2 рабочей программы). Варианты контрольной работы приведены в учебно-методическом пособии (п.2.1 – п.2.4).

Тема контрольной работы № 2: *Квантовые эффекты. Устройства нанoeлектроники* (Разделы 4-5 рабочей программы). Варианты контрольной работы приведены в учебно-методическом пособии (п. 2.5 -п.2.12).

Учебно-методическое пособие содержат варианты заданий для контрольных работ и индивидуальных заданий. Для самостоятельного изучения рекомендуется список литературы и приводятся справочные материалы.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Волна Де Бройля. Квантовое ограничение. Квантовые пленки.
2. Волна Де Бройля. Квантовое ограничение. Квантовые точки.
3. Волна Де Бройля. Квантовое ограничение. Квантовые шнуры.
4. Гетероструктуры. Энергетическая диаграмма ДГС. Основные требования, предъявляемые к гетероструктурам. Методы изготовления гетероструктур.
5. Сверхрешетки. Энергетические диаграммы сверхрешеток. Минизоны.
6. Сверхрешетки. Энергетические диаграммы сверхрешеток. Свойство электронов в сверхрешетках.
7. Баллистический транспорт. Квант сопротивления. Квант проводимости.
8. Способы формирования квантоворазмерных структур. Формирование квантовых точек.
9. Способы формирования квантоворазмерных структур. Формирование квантовых проволок.
10. Способы формирования квантоворазмерных структур. Формирование квантовых пленок.

11. Двумерный электронный газ в магнитном поле. Уровни Ландау.
12. Целочисленный и дробный эффект Холла.
13. Эффект Штарка. Эффект Штарка в гетероструктурах с квантовыми ямами.
14. Туннельный эффект. Коэффициент прозрачности барьера. Резонансный туннельный эффект.
15. Эффект Джозефсона. Практическое применение эффекта Джозефсона.
16. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с одним туннельным переходом.
17. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с двумя туннельными переходами одинаковой прозрачности.
18. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с двумя туннельными переходами различной прозрачности.
19. Сотунелирование. Где наблюдается. Причины.
20. Резонансно туннельный диод. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. ВАХ.
21. Резонансно туннельный транзистор. Конструкция. Принцип работы. ВАХ.
22. Одноэлектронный транзистор. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Передаточные и выходные характеристики.
23. НЕМТ транзисторы. Конструкции рНЕМТ транзисторов. Принцип работы. Передаточные и выходные характеристики. Применение.
24. НЕМТ транзисторы. Конструкции mНЕМТ транзисторов. Принцип работы. Передаточные и выходные характеристики. Применение.
25. Светодиоды и лазеры на основе ДГС. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Основные характеристики. Применение.
26. Светодиоды и лазеры на основе ДГС и квантовых точек. Конструкции. Принцип работы. Достоинства и недостатки.
27. Квантовые каскадные лазеры. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Применение.
28. ИК-фотоприемники. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Применение.
29. Оптические модуляторы. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Применение.
30. Лавинные фотодиоды. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Применение.

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

12.1 Основная литература

12.1.1. Борисенко В. Е. **Нанoeлектроника**: учебное пособие для вузов / В. Е. Борисенко, А. И. Воробьева, Е. А. Уткина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-94774-914-4 (81)

12.1.2 Троян П.Е. **Нанoeлектроника**: учебное пособие / П.Е. Троян, Ю.В. Сахаров. - Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. – Томск: ТУСУР, 2010. – 88 с. (15)

12.2 Дополнительная литература

12.2.1. Чаплыгин Ю.А. **Нанотехнологии в электронике**: Монография / Н. И. Боргардт [и др.] ; ред. Ю. А. Чаплыгин ; Московский государственный институт электронной техники. - М. : Техносфера, 2005. - 446 с. - ISBN 5-94836-059-8 (20)

12.2.2. Драгунов В.П. **Основы нанoeлектроники**: учебное пособие для вузов / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин. - М. : Физматкнига ; М. : Логос ; М. : Университетская книга, 2006. - 494 с. - ISBN 5-98704-054-X. - ISBN 5-89155-149-7 (32).

12.2.3. Неволин В.К. **Зондовые нанотехнологии в электронике** / В.К. Неволин. – М.: Техносфера, 2005. – 147 [5] с. (9)

12.2.4. **Нанотехнологии в полупроводниковой электронике**: Коллективная монография / Российская Академия наук, Сибирское отделение, Институт физики полупроводников; ред. А.Л. Асеев. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2004. – 367 [1] с. (10)

12.2.5. **Электроника**: Учебное пособие для вузов / А.А. Щука; ред. А.С. Сигов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 799 с. (3)

12.3 Учебно-методические пособия и программное обеспечение

12.3.1. Троян П.Е. **Нанoeлектроника**: Учебно-методическое пособие и пособие по самостоятельной работе для ВУЗов / П.Е. Троян, Ю.В. Сахаров. изд-во Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 20 с – [электронный ресурс]. – http://miel.tusur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=238

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В связи с большим количеством графического материала и рисунков по данной дисциплине лекционные занятия следует проводить с применением проектора и компьютера и обеспечивать слушателей раздаточным материалом. Конспектирование студентами лекционного материала обязательно.

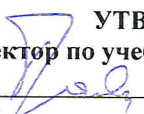
Практические занятия следует проводить в компьютерном классе с использованием математического пакета.

Лабораторные работы проводятся по традиционной методике в специализированной лабораторной аудитории каф. ФЭ. Допуск к выполнению лабораторных работ студент получает после получения соответствующего инструктажа по технике безопасности.



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
 П. Е. Троян
«25» 08 2016 г.

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ**

НАНОЭЛЕКТРОНИКА

(полное наименование учебной дисциплины или практики)

Уровень основной образовательной программы бакалавриат
(бакалавриат, магистратура, специалитет)

Направление(я) подготовки (специальность) 28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника

(полное наименование направления подготовки (специальности))

Профиль(и) «Нанотехнологии в электронике и микросистемной технике»
(полное наименование профиля направления подготовки (специальности))

Форма обучения очная
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная)

Факультет электронной техники (ФЭТ)
(сокращенное и полное наименование факультета)

Кафедра физической электроники (ФЭ)
(сокращенное и полное наименование кафедры)

Курс 3 Семестр 5

Учебный план набора 2013 года и последующих лет.

Зачет _____ семестр Диф. зачет _____ семестр

Экзамен 5 семестр

Разработчики: доцент каф. ФЭ Сахаров Ю.В.

Томск 2016

1 Введение

Фонд оценочных средств (ФОС) является приложением к рабочей программе дисциплины «Нанoeлектроника» и представляет собой совокупность контрольно-измерительных материалов (типовые задачи (задания), контрольные работы, тесты и др.) и методов их использования, предназначенных для измерения уровня достижения студентом установленных результатов обучения.

ФОС по дисциплине «Нанoeлектроника» используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов.

Перечень закрепленных за дисциплиной «Нанoeлектроника» компетенций приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень закрепленных за дисциплиной компетенций

| Код | Формулировка компетенции | Этапы формирования компетенции |
|-------|--|--|
| ОПК-5 | Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных | Знать основные приемы представления и обработки экспериментальных данных приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. Уметь проводить обработку экспериментальных данных приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. Владеть методикой представления и обработки экспериментальных данных приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. |
| ОПК-7 | Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности | Знать современное состояние и тенденции развития нанoeлектроники и микросистемной техники. Физические принципы измерений и современную измерительную технику в области нанoeлектроники и микросистемной техники. Уметь проводить анализ научно-технической литературы в области нанoeлектроники. Проводить измерения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. Владеть физическими принципами работы приборов и устройств нанoeлектроники. Методикой проведения измерений параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. |

| | | |
|-------------|---|--|
| ПК-1 | Способностью проводить физико-математическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных технологий. | <p>Знать программные средства для расчета и моделирования приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники.</p> <p>Уметь пользоваться программными средствами для расчета и моделирования приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники.</p> <p>Владеть методикой расчета и моделирования приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники.</p> |
|-------------|---|--|

2 Реализация компетенций

2.1. Компетенция ОПК-5

ОПК-5: Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в **таблице 2.1**

Таблица 2.1– Этапы формирования компетенции ОПК-5 и используемые средства оценивания

| 1. Состав | Знать | Уметь | Владеть |
|---|---|---|---|
| Содержание этапов | Знать основные приемы представления и обработки экспериментальных данных приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники | Уметь проводить обработку экспериментальных данных приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники | Владеть методикой представления и обработки экспериментальных данных приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники |
| Виды занятий | Лекции; Практические занятия; Индивидуальные задания | Практические занятия; Индивидуальные задания | Практические занятия; Индивидуальные задания |
| Используемые средства оценивания | Контрольные работы; Тесты; Защита индивидуальных заданий; Выполнение практических занятий | Контрольные работы; Защита индивидуальных заданий; Выполнение практических занятий; | Контрольные работы; Защита индивидуальных заданий; Выполнение практических занятий |

2.2. Компетенция ОПК-7

ОПК-7: Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в **таблице 2.2**

Таблица 2.2 – Этапы формирования компетенции ОПК-7 и используемые средства оценивания

| 2. Состав | Знать | Уметь | Владеть |
|---|--|--|---|
| Содержание этапов | Знать современное состояние и тенденции развития нанoeлектроники. Физические принципы измерений и современную измерительную технику в области нанoeлектроники и микросистемной техники. | Уметь проводить анализ научно-технической литературы в области нанoeлектроники. Проводить измерения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. | Владеть физическими принципами работы приборов и устройств нанoeлектроники. Методикой проведения измерений параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. |
| Виды занятий | Лекции; Практические занятия; Индивидуальные задания; | Практические занятия; Индивидуальные задания; | Практические занятия; Индивидуальные задания; |
| Используемые средства оценивания | Контрольные работы; Тесты; Защита индивидуальных заданий; Выполнение практических занятий | Контрольные работы; Индивидуальные задания; Защита практических занятий | Защита практических занятий Выполнение и защита индивидуальных заданий |

2.3. Компетенция ПК-1

ПК-1: Способностью проводить физико-математическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных технологий.

Для формирования компетенции необходимо осуществить ряд этапов. Этапы формирования компетенции, применяемые для этого виды занятий и используемые средства оценивания представлены в **таблице 2.3**.

Таблица 2.3 – Этапы формирования компетенции ПК-1 и используемые средства оценивания

| 3. Состав | Знать | Уметь | Владеть |
|------------------|--------------|--------------|----------------|
|------------------|--------------|--------------|----------------|

| | | | |
|---|--|--|---|
| Содержание этапов | Знать программные средства для расчета и моделирования приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. | Уметь пользоваться программными средствами для расчета и моделирования приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. | Владеть методикой расчета и моделирования приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. |
| Виды занятий | Лекции; Индивидуальные задания; | Практические занятия; Индивидуальные задания; | Практические занятия; Индивидуальные задания; |
| Используемые средства оценивания | Контрольные работы; Тесты; Защита индивидуальных заданий; Выполнение практических занятий | Контрольные работы; Выполнение лабораторных работ и защита отчетов; Индивидуальные задания; Защита практических занятий | Выполнение индивидуальных заданий и защита отчетов; Защита практических занятий |

3 Оценка компетенций

3.1. Компетенция ОПК-5

ОПК-5: Способностью использовать основные приемы обработки и представления экспериментальных данных.

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам

| Показатели и критерии | Знать | Уметь | Владеть |
|----------------------------------|---|---|--|
| Отлично (высокий уровень) | Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости | Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем | Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы |
| Хорошо (базовый уровень) | Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области | Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования | Берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем |
| Удовлетворительно | Обладает базовыми | Обладает основными | Работает при прямом |

| | | | |
|----------------------------|-----------------|---|------------|
| (пороговый уровень) | общими знаниями | умениями, требуемыми для выполнения простых задач | наблюдении |
|----------------------------|-----------------|---|------------|

Формулировка показателей и критериев оценивания компетенции ОПК-2 приведена в **таблице 3.2.**

Таблица 3.2 - Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

| Показатели и критерии | Знать | Уметь | Владеть |
|--|--|--|--|
| Отлично (высокий уровень) | Знает основные приемы обработки и представления экспериментальных данных приборов и устройств наноэлектроники и микросистемной техники с использованием современного программного обеспечения; статистический анализ. | Умеет проводить обработку и представление экспериментальных данных приборов и устройств наноэлектроники и микросистемной техники с использованием современного программного обеспечения; проводить статистический анализ и прогнозирование. | Владеет методикой обработки и представления экспериментальных данных приборов и устройств наноэлектроники и микросистемной техники с использованием статистического анализа и прогнозирования |
| Хорошо (базовый уровень) | Знает основные приемы обработки и представления экспериментальных данных приборов и устройств наноэлектроники и микросистемной техники с использованием современного программного обеспечения. | Умеет проводить обработку и представление экспериментальных данных приборов и устройств наноэлектроники и микросистемной техники с использованием современного программного обеспечения. | Владеет методикой обработки и представления экспериментальных данных приборов и устройств наноэлектроники и микросистемной техники. |
| Удовлетворительно (пороговый уровень) | Знает основные параметры приборов и устройств наноэлектроники, а также перечень справочной и методической литературы с примерами расчета | Умеет решать простые задачи, используя справочную и методическую литературу с примерами расчета приборов и устройств наноэлектроники и микросистемной | Владеет методикой расчета параметров гетероструктур, а также методикой поиска справочной и методической литературы с примерами расчета приборов и |

| | | | |
|--|---|---------|---|
| | приборов и устройств наноэлектроники и микросистемной техники | техники | устройств наноэлектроники и микросистемной техники. |
|--|---|---------|---|

3.2. Компетенция ОПК-7

ОПК-7: Способностью учитывать современные тенденции развития электроники, измерительной и вычислительной техники, информационных технологий в своей профессиональной деятельности.

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам

| Показатели и критерии | Знать | Уметь | Владеть |
|--|---|---|--|
| Отлично (высокий уровень) | Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости | Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем | Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы |
| Хорошо (базовый уровень) | Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области | Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования | Берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем |
| Удовлетворительно (пороговый уровень) | Обладает базовыми общими знаниями | Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач | Работает при прямом наблюдении |

Формулировка показателей и критериев оценивания компетенции ОПК-7 приведена в таблице 3.4.

Таблица 3.4. - Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

| Показатели и критерии | Знать | Уметь | Владеть |
|----------------------------------|--|---|--|
| Отлично (высокий уровень) | Знает современное состояние и тенденции развития | Умеет проводить анализ научно-технической | Владеет практическими навыками работы на |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>нанoeлектроники и измерительной техники, используемой для определения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. Диапазон и физический смысл измеряемых параметров</p> | <p>литературы в области нанoeлектроники и микросистемной техники. Проводить измерения параметров приборов и устройств нанoeлектроники</p> | <p>современном измерительном оборудовании, используемом для определения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники.</p> |
| <p>Хорошо (базовый уровень)</p> | <p>Знает современное состояние нанoeлектроники и измерительной техники, используемой для определения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. Диапазон и физический смысл измеряемых параметров</p> | <p>Умеет проводить измерения параметров типовых приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники.</p> | <p>Владеет практическими навыками работы на современном измерительном оборудовании, используемом для определения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники под руководством оператора.</p> |
| <p>Удовлетворительно (пороговый уровень)</p> | <p>Знает перечень типового измерительного оборудования используемого для определения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники.</p> | <p>Умеет проводить простые измерения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники с использованием типового измерительного оборудования</p> | <p>Владеет методикой работы на типовом измерительном оборудовании, используемом для определения параметров приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники при прямом участии оператора.</p> |

3.3. Компетенция ПК-1

ПК-1: Способностью проводить физико-математическое моделирование исследуемых процессов нанотехнологии и объектов нано- и микросистемной техники с использованием современных компьютерных технологий.

Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам приведены в **таблице 3.5**.

Таблица 3.5 – Общие характеристики показателей и критериев оценивания компетенции по этапам

| Показатели и критерии | Знать | Уметь | Владеть |
|--|---|---|--|
| Отлично (высокий уровень) | Обладает фактическими и теоретическими знаниями в пределах изучаемой области с пониманием границ применимости | Обладает диапазоном практических умений, требуемых для развития творческих решений, абстрагирования проблем | Контролирует работу, проводит оценку, совершенствует действия работы |
| Хорошо (базовый уровень) | Знает факты, принципы, процессы, общие понятия в пределах изучаемой области | Обладает диапазоном практических умений, требуемых для решения определенных проблем в области исследования | Берет ответственность за завершение задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к обстоятельствам в решении проблем |
| Удовлетворительно (пороговый уровень) | Обладает базовыми общими знаниями | Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых задач | Работает при прямом наблюдении |

Формулировка показателей и критериев оценивания компетенции ПК-1 приведена в **таблице 3.6.**

Таблица 3.6 - Показатели и критерии оценивания компетенции на этапах

| Показатели и критерии | Знать | Уметь | Владеть |
|----------------------------------|---|--|--|
| Отлично (высокий уровень) | Знает в совершенстве современные программные комплексы для моделирования и расчета приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники | Умеет строить сложные физические и математические модели приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники с использованием современных программных комплексов. | Владеет методикой построения сложных физических и математических моделей приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники. |
| Хорошо (базовый уровень) | Знает основные программные комплексы для моделирования и расчета приборов и | Умеет строить простые физические и математические модели приборов и устройств | Владеет методикой построения простых физических и математических моделей приборов и |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | устройств нанoeлектроники и микросистемной техники | нанoeлектроники и микросистемной техники с использованием современных программных комплексов. | устройств нанoeлектроники и микросистемной техники |
| Удовлетворительно (пороговый уровень) | Знает перечень основных программных комплексов для моделирования и расчета приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники | Умеет строить типовые физические и математические модели приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники с использованием программных комплексов, при наличии руководства пользователя | Владеет методикой построения типовых физических и математических моделей приборов и устройств нанoeлектроники и микросистемной техники при наличии руководства пользователя |

4 Типовые контрольные задания

Для реализации вышеперечисленных задач обучения используются, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в составе: тесты, контрольные работы, индивидуальные задания, практические задания, экзамен.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, в составе:

4.1. Контрольные работы:

Тема контрольной работы № 1: *Физические основы нанoeлектроники* (Раздел 2 рабочей программы). Варианты контрольной работы приведены в учебно-методическом пособии (п.2.1 – п.2.4).

Тема контрольной работы № 2: *Квантовые эффекты. Устройства нанoeлектроники* (Разделы 4-5 рабочей программы). Варианты контрольной работы приведены в учебно-методическом пособии (п. 2.5 - п.2.12).

4.2. Тесты по следующим разделам:

1. Физические основы нанoeлектроники.;
2. Квантовые эффекты;
3. Устройства нанoeлектроники.

4.3. Индивидуальные задания

Выполнение домашних индивидуальных заданий на тему: «*Расчет устройств нанoeлектроники*». Варианты приведены в учебно-методическом пособии (п.5)

4.4. Темы практических занятий:

1. Квантовое ограничение. Энергетические диаграммы сверхрешеток
2. Полупроводниковые гетероструктуры. Сверхрешетки. Полупроводниковые сверхрешетки.
3. 2D-электронный газ в магнитном поле. Целочисленный и дробный квантовый эффект Холла. Туннельный эффект. Эффект Джозефсона
4. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с одним туннельным переходом. Кулоновская блокада с двумя туннельными переходами
5. Инфракрасные фотоприемники. Квантовые каскадные лазеры.
6. Одноэлектронный транзистор

4.5. Экзамен:

Вопросы для подготовки к экзамену:

31. Волна Де Бройля. Квантовое ограничение. Квантовые пленки.
32. Волна Де Бройля. Квантовое ограничение. Квантовые точки.
33. Волна Де Бройля. Квантовое ограничение. Квантовые шнуры.
34. Гетероструктуры. Энергетическая диаграмма ДГС. Основные требования, предъявляемые к гетероструктурам. Методы изготовления гетероструктур.
35. Сверхрешетки. Энергетические диаграммы сверхрешеток. Минизоны.
36. Сверхрешетки. Энергетические диаграммы сверхрешеток. Свойство электронов в сверхрешетках.
37. Баллистический транспорт. Квант сопротивления. Квант проводимости.
38. Способы формирования квантоворазмерных структур. Формирование квантовых точек.
39. Способы формирования квантоворазмерных структур. Формирование квантовых проволок.
40. Способы формирования квантоворазмерных структур. Формирование квантовых пленок.
41. Двумерный электронный газ в магнитном поле. Уровни Ландау.
42. Целочисленный и дробный эффект Холла.
43. Эффект Штарка. Эффект Штарка в гетероструктурах с квантовыми ямами.
44. Туннельный эффект. Коэффициент прозрачности барьера. Резонансный туннельный эффект.
45. Эффект Джозефсона. Практическое применение эффекта Джозефсона.
46. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с одним туннельным переходом.
47. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с двумя туннельными переходами одинаковой прозрачности.
48. Кулоновская блокада. Кулоновская блокада с двумя туннельными переходами различной прозрачности.
49. Сотуннелирование. Где наблюдается. Причины.
50. Резонансно туннельный диод. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. ВАХ.
51. Резонансно туннельный транзистор. Конструкция. Принцип работы. ВАХ.

52. Одноэлектронный транзистор. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Передаточные и выходные характеристики.
53. НЕМТ транзисторы. Конструкции рНЕМТ транзисторов. Принцип работы. Передаточные и выходные характеристики. Применение.
54. НЕМТ транзисторы. Конструкции mНЕМТ транзисторов. Принцип работы. Передаточные и выходные характеристики. Применение.
55. Светодиоды и лазеры на основе ДГС. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Основные характеристики. Применение.
56. Светодиоды и лазеры на основе ДГС и квантовых точек. Конструкции. Принцип работы. Достоинства и недостатки.
57. Квантовые каскадные лазеры. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Применение.
58. ИК-фотоприемники. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Применение.
59. Оптические модуляторы. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Применение.
60. Лавинные фотодиоды. Конструкция. Энергетическая диаграмма. Принцип работы. Применение.

5 Методические материалы

Для обеспечения процесса обучения и решения задач обучения используются следующие материалы:

5.1 Основная литература

5.1.1. Борисенко В. Е. **Нанозлектроника**: учебное пособие для вузов / В. Е. Борисенко, А. И. Воробьева, Е. А. Уткина. - М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 224 с. - ISBN 978-5-94774-914-4 **(81)**

5.1.2 Троян П.Е. **Нанозлектроника**: учебное пособие / П.Е. Троян, Ю.В. Сахаров. - Министерство образования и науки Российской Федерации, Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. – Томск: ТУСУР, 2010. – 88 с. **(15)**

5.2 Дополнительная литература

5.2.1. Чаплыгин Ю.А. **Нанотехнологии в электронике**: Монография / Н. И. Боргардт [и др.] ; ред. Ю. А. Чаплыгин ; Московский государственный институт электронной техники. - М. : Техносфера, 2005. - 446 с. - ISBN 5-94836-059-8 **(20)**

5.2.2. Драгунов В.П. **Основы нанозлектроники**: учебное пособие для вузов / В. П. Драгунов, И. Г. Неизвестный, В. А. Гридчин. - М. : Физматкнига ; М. : Логос ; М. : Университетская книга, 2006. - 494 с. - ISBN 5-98704-054-X. - ISBN 5-89155-149-7 **(32)**.

5.2.3. Неволин В.К. **Зондовые нанотехнологии в электронике** / В.К. Неволин. – М.: Техносфера, 2005. – 147 [5] с. **(9)**

5.2.4. **Нанотехнологии в полупроводниковой электронике**: Коллективная монография / Российская Академия наук, Сибирское отделение, Институт физики полупроводников; ред. А.Л. Асеев. – Новосибирск: Издательство СО РАН, 2004. – 367 [1] с. **(10)**

5.2.5. **Электроника**: Учебное пособие для вузов / А.А. Щука; ред. А.С. Сигов. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. – 799 с. **(3)**

5.3 Учебно-методические пособия и программное обеспечение

5.3.1. Троян П.Е. **Наноэлектроника:** Учебно-методическое пособие по аудиторным практическим занятиям и самостоятельной работе / П.Е. Троян, Ю.В. Сахаров. изд-во Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. – 31 с – [электронный ресурс]. – http://miel.tusur.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=238

6. Материально техническое обеспечение дисциплины

В связи с большим количеством графического материала и рисунков по данной дисциплине лекционные занятия следует проводить с применением проектора и компьютера и обеспечивать слушателей раздаточным материалом. Конспектирование студентами лекционного материала обязательно.

Практические занятия следует проводить в компьютерном классе с использованием математического пакета.

Лабораторные работы проводятся по традиционной методике в специализированной лабораторной аудитории каф. ФЭ. Допуск к выполнению лабораторных работ студент получает после получения соответствующего инструктажа по технике безопасности.